



Laboratorio  
**LABTESA S.A.**

Sr(es).  
TERMICA SAN LUIS S.A. (51549)

O.T. 00164715

Fecha: 15/02/2001

Pag.: 1/2

## CERTIFICADO DE ANALISIS

### REFERENCIAS:

La(s) muestra(s) se identifica(n) de la siguiente manera:

**MUESTRA 1: PLACA DE PIR ( 300 X 300 X 95 MM) - PROD.  
OCTUBRE 2000 - M.P.DOW.**

Fecha de Recepción de la muestra: 30/01/2001

Fecha de Finalización del ensayo: 15/02/2001

### TRABAJOS REALIZADOS:

ENSAYOS ELECTRICOS

### RESULTADOS:

Los resultados obtenidos son los siguientes:

#### MEDICION DE CONDUCTIVIDAD

##### - NORMA APLICADA:

S/Norma ASTM C-591

##### - EQUIPO UTILIZADO

- Microcontrolador de Temperatura S-9800 - TAG MM90
- Medidor de Temperatura TM-905 TAG-MM138
- Termocupla marca LUFTMAN TAG-MM138
- Medidor de Energia TAG-MM91

##### - RESULTADO DE LOS ENSAYOS

- Densidad: 41 Kg/m<sup>3</sup>

##### - PRIMERA CONDICION

- Temperatura de Cara Caliente: 23° C
- Temperatura de Cara Fría: -15° C
- Temperatura Promedio: 4° C
- Conductividad Termica: 0,021 W

m°K



Laboratorio  
**LABTESA S.A.**

Sr(es).  
**TERMICA SAN LUIS S.A. (51549)**

O.T. **00164715**

Fecha: **15/02/2001**

Pag.: **2/2**

## **CERTIFICADO DE ANALISIS**

### **MEDICION DE CONDUCTIVIDAD (Continuación)**

- Resistencia Térmica de  
espesor 25,4 mm: 1,21 m<sup>2</sup> °K

W

#### **- SEGUNDA CONDICION**

- Temperatura de Cara Caliente: 43° C  
- Temperatura de Cara Fría: 4° C  
- Temperatura Promedio: 23,5° C  
- Conductividad Termica: 0,023 W

m° K

- Resistencia Térmica de  
25,4 mm de espesor: 1,10 m<sup>2</sup> °K

W

#### **- TERCERA CONDICION**

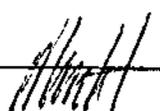
- Temperatura de Cara Caliente: 60° C  
- Temperatura de Cara Fría: 30° C  
- Temperatura Promedio: 45° C  
- Conductividad Termica: 0,026 W

m° K

- Resistencia Térmica de  
25,4 mm de espesor: 0,97 m<sup>2</sup> °K

W

Cant. Pág.:2

  
LABTESA  
WALTER MASI  
JEFE DE LABORATORIO  
I. Q. M. A. N° 374

Brandsen 2933 - Cuidadela - Tel.: 4712-5484 4757-7818/7762